

平成25年度第1次募集（平成24年10月入学含む。）  
新潟大学大学院自然科学研究科博士前期課程入学者選抜試験問題

一般入試

材料生産システム専攻  
機能材料科学コース（物性系）

B1

専門科目（材料科学（物性系））

注意事項

- 1 この問題冊子は、試験開始の合図があるまで開いてはならない。
- 2 問題冊子は、表紙を含めて全部で6ページある。
- 3 解答用紙にも注意事項が記載されているので、その指示に従うこと。  
解答は、すべて指定された解答用紙に記入すること。  
指定された解答用紙の中に自由に記入してよいが、解答した問題が分かるようにすること。裏面に解答する場合も、その旨、表面に明記すること。
- 4 受験番号は、各解答用紙の指定された箇所に必ず記入すること。
- 5 解答時間は、180分である。
- 6 下書きは、問題冊子の余白を使用すること。

[1] 質量  $m$ , 角振動数  $\omega$  の 1 次元調和振動子のハミルトニアンは,

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

である。新しい演算子,

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{i}{m\omega}p\right), \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{i}{m\omega}p\right)$$

を導入すると, シュレーディンガー方程式は,

$$\hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right)u_n = E_n u_n, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

となる。ここで,  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$  であり,  $h$  はプランク定数,  $i = \sqrt{-1}$  である。また,  $u_n$  と  $E_n$  は固有関数とエネルギー固有値である。以下の設問 (1) ~ (7) に答えよ。

(1)  $[x, p] = xp - px = i\hbar$  の関係を使って,  $[a, a^\dagger] = 1$  を示せ。

(2) 基底状態に対しては,

$$\hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right)u_0 = E_0 u_0$$

が成り立つ。この両辺に左から  $a$  を作用させて,

$$\hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right)au_0 = (E_0 - \hbar\omega)au_0$$

を示せ。

(3) 前設問 (2) の結果から,

$$au_0 = 0$$

でなければならない。理由を述べよ。

(4)  $a$  を微分演算子で表すと, 前設問 (3) の方程式は,

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx}\right)u_0(x) = 0$$

となる。 $u_0(x) = N_0 \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)$  が, この微分方程式の解であることを示せ。 $N_0$  は規格化の定数である。

(5)  $u_0(x)$  の概略を図示せよ。

(6) ガウス積分  $\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-x^2)dx = \sqrt{\pi}$  を使って, 規格化定数  $N_0$  を求めよ。

(7) 位置  $x$  の期待値  $\langle x \rangle$  を求めよ。ただし, 規格化定数を  $N_0$  として計算せよ。

[II] 1辺が  $L$  の立方体に閉じこめられた  $N_0$  個の自由電子系がある。周期的な境界条件を課すと、そのエネルギーは

$$\varepsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{2\pi n}{L} \right)^2, \quad n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2, \quad n_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (i = x, y, z)$$

で与えられる。ここで、 $m$  は電子の質量、 $\hbar$  はPlanck定数  $h$  を  $2\pi$  で割った値である。また、電子のスピン量子数は  $1/2$  である。以下の設問 (1) ~ (3) に答えよ。

(1) 電子の状態密度  $D(\varepsilon)$  を求めたい。問①と②に答えよ。

① エネルギーが  $\frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{2\pi}{L} n \right)^2$  以下に存在する状態の数  $g(n)$  を求めよ。 $L$  は十分大きくエネルギーは連続で近似できるものとせよ。

② エネルギーが  $\varepsilon$  と  $\varepsilon + d\varepsilon$  の幅にいる状態の数は  $D(\varepsilon)d\varepsilon$  である。 $D(\varepsilon)$  を求めよ。

(2) 有限の温度  $\tau$  におけるエネルギー  $\varepsilon$  の電子の数  $N(\varepsilon)$  を求めたい。問③~⑤に答えよ。ただし、 $\tau$  は統計力学的温度である。

③ エネルギー  $\varepsilon$  の電子1個あたりの大分配関数  $\Xi$  を求めよ。ただし、系の化学ポテンシャルを  $\mu$  とする。

④ 前問③の結果を使って、Fermi-Dirac分布関数  $f(\varepsilon)$  を求めよ。

⑤  $N(\varepsilon)$  を  $D(\varepsilon)$ ,  $f(\varepsilon)$  で書け。

(3) この電子系のFermiエネルギーが  $\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left[ 3\pi^2 \left( \frac{N_0}{L^3} \right) \right]^{2/3}$  となることを示せ。

[Ⅲ] 半導体に関する以下の設問 (1) と (2) に答えよ。

(1) 真性半導体および不純物半導体に関する以下の問①～⑤に答えよ。

- ① 真性半導体における伝導帯の電子を，共有結合と関連付けて説明せよ。
- ② 価電子帯の電子を，共有結合と関連付けて説明せよ。
- ③ 禁制帯幅を，共有結合と関連付けて説明せよ。
- ④ Si 半導体において，ドナーとして振舞う不純物の特徴を述べよ。
- ⑤ シリコン結晶でのドナーのイオン化エネルギーが何 eV かを，ボーアの  
水素原子模型を用いて求めよ。ただし，ボーアの理論における水素原子  
のエネルギー準位は，電子の電荷の大きさ  $q$ ，電子の質量  $m$ ，真空の誘電  
率  $\epsilon_0$ ，プランク定数  $h$ ，主量子数  $n$  を用いた次式で表され， $n=1$  の基底  
状態におけるエネルギーの絶対値は約 14eV である。

$$E_n = -\frac{q^4 m}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$$

シリコンにおける比誘電率  $\epsilon_r$  は 12，電子の有効質量  $m_e$  は  $0.33m$  とする。

(2) 階段形の pn 接合に関する以下の問①～⑤に答えよ。

- ① 熱平衡状態で pn 接合界面領域にキャリアが存在しない空乏層が生じる理由を述べよ。
- ② 熱平衡状態で空乏層内に電界が生じる理由を述べよ。
- ③ 接合界面に垂直で，n 形領域から p 形領域への方向を正として  $x$  軸をとる。n 形半導体に対して p 形半導体にバイアス電圧  $V$  を印加したとき，p 形領域の空乏層端 ( $x=x_p$ ) での電子電流密度は

$$j_e(x_p) = -\frac{qD_e}{L_e} n_{p0} (e^{qV/kT} - 1)$$

で，n 形領域の空乏層の端 ( $x=x_n$ ) での正孔

$$j_h(x_n) = -\frac{qD_h}{L_h} p_{n0} (e^{qV/kT} - 1)$$

電流密度は  $j_h(x_n) = -\frac{qD_h}{L_h} p_{n0} (e^{qV/kT} - 1)$  で表される。ここで，p 形領域の  
電子の熱平衡濃度は  $n_{p0}$ ，n 形領域の正孔の熱平衡濃度は  $p_{n0}$ ，電子の拡散  
定数は  $D_e$ ，正孔の拡散定数は  $D_h$ ，電子の拡散距離は  $L_e$ ，正孔の拡散距離  
は  $L_h$ ，電子の電荷の大きさは  $q$ ，ボルツマン定数は  $k$  および温度は  $T$  であ  
る。空乏層内では電子と正孔が再結合しないものとして，全電流密度  $j$  を

[次ページに続く]

求めよ。なお、 $j_e$ および $j_h$ は $x$ 軸の正方向の流れを正として表すが、 $j$ は $x$ 軸の負方向の流れを正として表すものとする。

- ④ 逆方向にバイアス電圧を印加したときの飽和電流密度 $j_s$ を、 $D_e$ 、 $D_h$ 、 $L_e$ 、 $L_h$ 、 $q$ 、 $N_A$ 、 $N_D$ および $n_i$ を用いて表せ。ここで、 $N_A$ 、 $N_D$ および $n_i$ は、それぞれアクセプタ濃度、ドナー濃度および真性キャリア濃度である。ただし、ドナーとアクセプタは完全にイオン化しているものとする。
- ⑤ 逆方向バイアス電圧での飽和電流密度は、禁制帯幅が大きくなると、どのように変化するか。理由と共に述べよ。ただし、イオン化している不純物の濃度、キャリアの拡散定数と拡散距離は変化しないものとする。

[IV] 金属中の電子について、以下の設問(1)と(2)に答えよ。

(1) 電子の電荷を  $q(<0)$  として、電気伝導に関する以下の問①と②に答えよ。

- ① 金属中の伝導電子の有効質量  $m^*$  が、真空中の電子の質量とは異なる原因を1つ挙げ、その原因により重くなるか軽くなるか述べよ。
- ② 単位体積当たり  $n$  個の電子が平均速度  $v$  で運動するとき、電流密度の大きさを求めよ。

(2) 金属に一樣な電場  $E$  を印加する。以下の問③～⑦に答えよ。

③ このとき電子の平均速度  $v$  は、時間  $t$  に対して、運動方程式

$$m^* \left( \frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} \right) = qE$$
により記述される。ここで、 $\tau$  は散乱効果を表す定数である。定常状態での電子の平均速度  $v$  を、電場  $E$ 、 $m^*$ 、 $\tau$  を用いて表せ。

- ④ 以上の結果から、抵抗率  $\rho$  を  $n$ 、 $m^*$ 、 $\tau$  を用いて表せ。
- ⑤ 定常状態にあるこの金属に対して、時刻  $t=0$  で電場を突然ゼロにした。問③の運動方程式において、 $t=0$  での電子の平均速度を  $v_0$  として、 $t>0$  での電子の平均速度  $v$  の時間変化を求めよ。
- ⑥ 前問⑤の  $v$  の概略をグラフで表せ。
- ⑦ 不純物や欠陥が少ない金属では、 $\tau$  は大きくなるか、小さくなるか、理由とともに答えよ。